



Analyse de cause de défaillance sur cartes électroniques

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure d'appréhender une méthode pratique de recherche des causes de défaillance sur carte électronique.	Personnes concernées La formation s'adresse aux responsables qualité ou technique et ingénieurs d'analyse retour terrain/SAV ou confrontés à un besoin d'amélioration de la fiabilité de carte électronique. Pré requis : aucun.
PROGRAMME	
LES ETAPES DE LA RECHERCHE DE CAUSE L'état des lieux : la description du défaut et son contexte d'apparition La confirmation/caractérisation du défaut La localisation du défaut niveau carte et composant L'observation/expertise du défaut La recherche et pondération du mécanisme de défaillance La recherche et pondération des causes de défaillance	PEDAGOGIE
LA DESCRIPTION DU DEFAUT ET SON CONTEXTE D'APPARITION La description du produit et du défaut Le produit : sa conception, son procédé de fabrication, son historique Le défaut : les faits (données), les conditions d'apparition, le REX Les méthodes : QQQQC, 5W, ...	
LES METHODES DE LOCALISATION ET DE CARACTERISATION DU DEFAUT SUR CARTE Les modes de défaillances et leurs cas particuliers (intermittence, instabilité, combustion, ...) Les outils de localisation (objectifs, limites et risques d'altération du défaut) L'introduction aux familles de mécanisme de dégradation Les méthodes de caractérisation d'un défaut L'analyse de cohérence des résultats	Le Formateur Spécialiste des cartes électroniques. Méthodes pédagogiques Pédagogie interactive alternant les apports théoriques et les exercices pratiques. Remise d'un support aide-mémoire au participant. Modalités d'évaluation Tests de contrôle des connaissances à l'aide de QCM.
LES MECANISMES DE DEFAILLANCE Les mécanismes de défaillances des interfaces (PCB, brasures, connecteurs, boîtier plastique) Les mécanismes de défaillances des composants passifs (résistances couche mince/épaisse, condensateurs céramique/tantale/film/chimique, ...) Les mécanismes de défaillance des composants semi-conducteurs (diode, transistor, circuit intégré) La formalisation des hypothèses : liste, diagramme L'analyse statistique L'expertise en laboratoire La reproduction de défaut	Intra entreprise Lieu de formation : dans la ville de votre choix. Inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux Tarif de la formation par personne.
LES CAUSES DE DEFAILLANCE SUR CARTE ELECTRONIQUE Les familles de causes de défaillance sur carte électronique Les méthodes de revue des hypothèses : brainstorming, arbre de défaillance, diagramme cause-effet Les outils et critères de pondération Le plan d'expérience L'essai de robustesse L'audit de procédé de fabrication Les mesures sur le terrain	2 jours 1 150 € Réf : IND397

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Industrie partout en France

Formation *Analyse de cause de défaillance sur cartes électroniques*